# 一种有机薄膜器件的制备及电存储特性\*

郭 鹏 季 欣 董元伟 吕银祥 徐 伟\*

(复旦大学材料科学系,上海 200433)

摘要:研究了一种金属/有机物/金属夹层结构有机薄膜器件的可逆电双稳特性.器件的阳极和阴极分别为真空热蒸发沉积的 Ag 和 Al 薄膜,中间介质层为真空热蒸发沉积的 2-(hexahydropyrimidin-2-ylidene)-malononitrile (HPYM)有机薄膜.器件起始状态为非导通态,在大气环境下,可用正、反向电场进行信号的写入和擦除,表现为极性记忆特性.通过自然氧化的方法在底电极 Al 表面形成一层 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜层后,可使器件在不同的正向电压脉冲作用下达到不同的导电态,具有一定的多重态存储特性.同时,研究了不同的电极组合对器件电性能的影响,并通过紫外-可见吸收光谱以及喇曼光谱对器件界面进行表征.

关键词:有机薄膜器件;存储器;电双稳特性;多重态导电特性 EEACC: 2520M 中图分类号: O626 文献标识码:A 文章编号: 0253-4177(2008)01-0140-04

## 1 引言

用有机小分子材料和聚合物材料代替传统的无机 半导体作为信息存储介质,是分子电子学研究的新方 向<sup>[1]</sup>.目前已报道了多种基于有机半导体材料的夹层结 构存储器<sup>[2~10]</sup>.其中,对带有氰基基团的有机分子薄膜 器件电特性的研究成为热点<sup>[3~6]</sup>.因为氰基具有很强的 吸电子能力,可以在电场作用下与金属原子或者带有推 电子基团的有机分子间发生电荷转移或者偶极相互作 用,从而使器件发生导电态的转变<sup>[11,12]</sup>.美国加州大学 Yang 等人还报道了基于 2-amino-4,5-imidazole-dicarbonitrile (AIDCN)分子的电双稳器件,以 AIDCN/AI/ AIDCN 作为信息存储介质,并指出其中的非连续 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>颗粒是产生信息记录的关键<sup>[4]</sup>.但是,要制备这 种非连续 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>颗粒层,对工艺条件有严格的要求.

为了简化器件制作工艺,我们采用最简单的金属-有机物-金属(M-O-M)结构来实现电双稳功能,其中的 有机 层采 用具有 推吸 电子特征的 共轭有机分子 HPYM<sup>[13]</sup>.本文在前期研究<sup>[14]</sup>的基础上,进一步开发出 器件的多重态存储特性,并研究了界面处理以及不同组 合电极对器件电特性的影响.

#### 2 实验

用于本研究的分子材料为 2-(hexahydropyrimidin-2-ylidene)-malononitrile(HPYM),分子结构如图 1 所示.器件采用金属/有机物/金属的夹层结构.上下 电极垂直交叉,器件的有效接触面积约为 0.1mm<sup>2</sup>.用 清洁的载玻片作为蒸镀基板,依次蒸镀底电极金属(Al 或 Ag),有机薄膜和顶电极金属(Ag),蒸发过程中真空 室压强维持在 2×10<sup>-3</sup>Pa 以下.用石英晶体振荡仪监测 薄膜相对厚度及沉积速率.ITO/HPYM/Ag 器件的制备则直接在经过刻蚀和清洁后的 ITO 玻璃基板上依次 蒸镀有机和顶电极金属层.三类器件中间有机薄膜膜厚均约为 120nm,沉积速率约为 0.1nm/s;顶电极 Ag 膜厚约为 70nm,沉积速率为 0.02~0.1nm/s.

分别采用电脑控制的 Keithley2400 数字电表和 HP 4284A Precision LCR Meter 测量薄膜器件的电流-电压及电容、电导特性.测量时顶电极接输入信号正极, 底电极接地,测试在干燥的大气环境下进行.紫外-可见 吸收光谱测量采用日本 SHIMADZU 公司的 UV-2450 型光谱仪;喇曼光谱测量采用法国 JY 公司 LabRam-1B 型显微喇曼光谱仪,激发光波长为 632.8nm,功率为 4.3/8mW.

## 3 结果与讨论

在正、反向循环扫描电压作用下(扫描速率为100 mV/s),Al/HPYM/Ag薄膜器件的电流-电压曲线如图2所示.该器件的起始导电态为非导通态(off),随着正向电压逐渐升高接近3V(阈值电压,V<sub>thon</sub>),导电态发生跃迁成为导通态(on),且低阻状态始终保持,直到反向电压扫描接近-5V(阈值电压,-V<sub>thoff</sub>)时,低阻态被擦除.再次正向扫描时,仍能发生高、低阻态的跃迁.在相同电压作用时导通态和非导通态的电流比值约为10<sup>5</sup>~



图 1 HPYM 的分子结构 Fig. 1 Molecular structure of HPYM

†通信作者.Email:wexu@fudan.edu.cn

<sup>\*</sup>教育部跨世纪人才基金,国家自然科学基金(批准号:60171008),上海纳米技术专项基金(批准号:0214nm005,0452nm087)资助项目

<sup>2007-07-05</sup> 收到,2007-08-03 定稿



图 2 Al/HPYM/Ag 器件的典型 *I-V* 特性曲线 Fig.2 Typical *I-V* curves of an Al/HPYM/Ag device

10<sup>6</sup>.这种导电态的跃迁可多次重复,但 $V_{\text{thon}}$ 和 $V_{\text{thoff}}$ 并不恒定,约为2.5~5V.

在电场作用下,由于电极金属离子扩散而导致器件 短路是此类器件失效的一个主要原因.为了提高器件的 使用寿命,以及提高器件在大气环境下的稳定性,通过 自然氧化的方法在底电极 Al 膜表面生长一层 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄 膜作为扩散阻挡层.通过电容法测得其厚度约为 5~ 10nm.然后依次蒸镀 HPYM 和 Ag 电极,即制得 Al/ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/HPYM/Ag 薄膜器件.

用 0 到 +  $V_{Max}(V_{Max} < V_{thon})$ 往返扫描电压作用上 述器件,扫描速率为 10mV/s,每次折返扫描后用反向 偏压 – 2V 作用 30s 使器件恢复到起始绝缘态(state 0),相当于完成一次写入和擦除的过程.器件在正向扫 描电压作用下的电流响应如图 3 所示.当施加不同幅值 的  $V_{Max}(1.5, 2 和 2.3V)$ 作用器件,器件可以进入多重 导电态(state 1,state 2,state 3).

研究发现,工艺的改进可使器件状态的可控性得到 提高,用不同幅值的恒压脉冲作用也可使器件形成多重 导电态,并且可以用小偏压脉冲读出其状态信息,如图 4 所示.曲线 *a* 表示器件处于绝缘态(state A)时,在 0.6V恒压持续作用10<sup>4</sup>s过程中的电流响应;曲线*b*,*c*,*d* 



图 3 在 0V 到不同 V<sub>Max</sub> 折返扫描电压作用下的 Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/HPYM/Ag 器件 *I-V* 特性曲线

Fig. 3 I-V characteristics of an Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/HPYM/Ag device when the voltage swept from 0 to the different amplitudes of  $V_{\text{Max}}$  and back to 0V



图 4 Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/HPYM/Ag 器件在不同脉冲电压(1.5,2.0 和 2.5V)作 用下的多重写入状态,以及用 0.6V 恒压持续读取的电流随时间响应特性 Fig. 4 Multilevel memory states of an Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/HPYM/Ag device by applying written voltage pulses (1.5,2.0, and 2.5V, respectively), and extended time response of four different conducting states as probed by a probe bias of 0.6V

分别表示器件在 1.5,2 和 2.5V 电压脉冲作用下形成 多重导电态(state B, state C, state D)后,再分别由 0.6V 恒压持续读取 10<sup>4</sup> s 过程中的电流响应.在每次读 出操作结束后,用反向偏压 - 2V 作用 10s 进行信号的 擦除,使器件恢复至 state A,再次进行信号的写入.用 其他不同幅度的脉冲进行信号写入,还可以产生不同的 导电状态.器件各导电态电流在测试电压持续作用下表 现得比较稳定.若外接电压撤除,即"断电"后,各导电态 在大气环境下也能够维持数分钟至数小时.对于未经自 然氧化方法制备的 Al/HPYM/Ag 器件,这种多重态存 储特性很难被观测到.

此外,还分别测试了 Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/HPYM/Ag 器件处 于 OFF 态和 ON 态的电容( $c_{ON}$ ,  $c_{OFF}$ )及电导( $g_{ON}$ ,  $g_{OFF}$ )随频率的变化,如图 5 所示.其中 ON 态是由 2 V 脉冲电压激发而成.状态跃迁前后器件的电导发生很大 的变化,说明器件复阻抗的实部,即器件的等效电阻发



图 5 Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/HPYM/Ag 器件分别处于 OFF 态和 ON 态时,其电容 (c<sub>ON</sub>,c<sub>OFF</sub>)和电导(g<sub>ON</sub>,g<sub>OFF</sub>)随频率变化的曲线

Fig. 5 Frequency-dependent capacitance  $(c_{ON}, c_{OFF})$  and conductance  $(g_{ON}, g_{OFF})$  of an Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/HPYM/Ag device in both the ON and OFF states





Fig. 6 *I-V* characteristics of devices with different electrode combinations

生改变.在100Hz 到10<sup>5</sup>Hz 频率区间内,ON 态电容比 OFF 态电容高约1.3个量级;而在较高的频率区间内 ON 态电容迅速衰减并逐渐接近 OFF 态.实验说明这 种导电态的转变并不是由于介电击穿导致的器件短路, 而是由于电场作用下导致有机介质层介电常数发生改 变或者介质内带电单元增加引起的.

同时考察了不同电极组合(ITO/Ag,Ag/Ag及Al/ Al)对器件电特性的影响,如图 6 所示.先后用正向及反 向折返扫描电压(0→1V→0 以及 0→-1V→0)作用 ITO/HPYM/Ag 以及 Ag/HPYM/Ag 器件,两组器件 与 Al/HPYM/Ag 器件表现出类似的电流跃迁特性 (OFF→ON),但"断电"后,其 ON 态信息很难维持,自 动衰减恢复至 OFF 态.反向电压扫描,器件再次发生 OFF 态向 ON 态的转变.而上下电极均采用 Al 时,很 难观察到器件在电压作用下发生导电态的跃迁,器件始 终为小电流.在扫描电压作用下 Al/HPYM/Al 器件表 现出很强的电容效应.

实验说明器件的开关及记忆特性与金属电极有关. 其中,采用 Ag 作为顶电极的器件都具有明显的电双稳 特性,表明 Ag 原子或离子在电场作用下参与了介质膜 的导电态转变. Ag/HPYM/Ag 器件具有开关特性而 Al/HPYM/Al器件则没有,则说明Al电极及Al电极



在石英基底上分别蒸镀 HPYM(30nm)薄膜、Al (10nm)/HPYM(30nm)薄膜以及 HPYM(30nm)/Ag (10nm)薄膜后,测试其紫外-可见吸收光谱,如图 7 所示.Al/HPYM 双层薄膜与 HPYM 薄膜相比,其吸收峰 没有发生明显的变化,表明 HPYM 与 Al 没有发生反 应;而 HPYM/Ag 复合薄膜与 HPYM 薄膜相比,在 217 nm 处吸收峰发生位移,在 256nm 处吸收峰值显著增 强,并且在 340nm 处产生一个明显的吸收包,说明 Ag 与 HPYM 发生反应,形成了 Ag—HPYM 络合物.

HPYM分子中的-CN具有很强的吸电子能力和络合能力,容易与活泼金属形成金属/有机络合物.当顶电极Ag以较低的速率沉积在HPYM薄膜上时,热的Ag原子会向有机层中扩散,形成离散的金属颗粒分布在有机层中,同时与HPYM发生络合反应.特别是在Ag原子富集的界面区域,将与HPYM反应形成一层Ag一HPYM电荷转移络合物层.而Al在蒸发过程中容易在界面处形成一层很薄的氧化层,从而阻挡了金属原子与有机分子的络合.这种上、下界面的不对称性可能是Al/HPYM/Ag器件具有极性记忆特性的主要原因.

这个结论可通过比较 HPYM 薄膜与 HPYM/Ag 复合薄膜的喇曼光谱再次验证.分别测试了 HPYM 晶 体、HPYM 薄膜以及 HPYM/Ag 复合薄膜的喇曼光谱, 并进行比较,如图 8 所示.HPYM 薄膜与晶体的谱峰相 似,在 2170 到 2200cm<sup>-1</sup>区域内存在两个谱峰(2177 和 2200cm<sup>-1</sup>),是由于-CN 伸缩振动引起的,同时说明 HPYM 薄膜形态为多晶体形态;当在 HPYM 表面蒸镀 一层薄的 Ag 膜(10nm)时,1000 到 1700cm<sup>-1</sup>区域喇曼 信号显著增强,表现为表面增强喇曼光谱,且在原来 2170 到 2200cm<sup>-1</sup>区域谱峰扩展,并且发生一定程度的 紫移,表明 Ag 与 HPYM 的氰基发生络合反应,改变了 -CN原有的特征峰.









图 8 HPYM 晶体、HPYM 薄膜以及 HPYM/Ag 组合薄膜的喇曼光谱 Fig.8 Raman spectra of the HPYM crystal, HPYM film and HPYM/Ag films

### 4 结论

本文研究了一种金属/有机物/金属夹层结构的有 机薄膜器件的电学特性,其中有机分子 HPYM 同时拥 有电子给体(-NH)和受体基团(-CN).对于 Al/HPYM/ Ag夹层器件,器件的起始状态为非导通态,在大气环境 下,可用正、反电压信号进行写入和擦除[14],具有极性 记忆特性,进一步研究发现,通过简单的自然氧化的方 法在底电极 Al 表面形成一层致密 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜层后,Al/ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/HPYM/Ag夹层器件在不同的正向电压脉冲作 用下能达到不同的导电态,且该导电态在"断电"后能够 维持,具有一定的多重态存储特性.其中 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜的 质量是器件是否具有多重态存储特性的重要因素,若缺 失这层致密的金属氧化层,则多重态存储特性很难被观 察到. 对其他电极组合器件也进行了表征, ITO/ HPYM/Ag器件以及 Ag/ HPYM/Ag器件具有电双稳 特性,而 Al/ HPYM/Al 器件没有电双稳特性,说明器 件的特性还与电极材料有关.此外,光谱测量还说明 Ag 电极组分会扩散到 HPYM 有机层中,介质薄膜中存在 金属-有机络合物.本研究证明这类简单的夹层器件可 以实现"写、读和擦"功能,同时还说明器件的电性能与 界面处理以及电极组合状况有关.

#### 参考文献

- [1] Scott J C. Is there an immortal memory. Science, 2004, 304:62
- [2] Xu W, Chen G R, Li R J, et al. Two new all-organic complexes with electrical bistable states. Appl Phys Lett, 1995,67,2241
- [3] Oyamada T, Tanaka H, Matsushige K, et al. Switching effect in Cu: TCNQ charge transfer-complex thin films by vacuum codeposition. Nonvolatile electrical bistability of organic/metal-nanoclus-

ter/organic system. Appl Phys Lett, 2003, 83:1252

- [4] Ma L P, Pyo S, Ouyang J Y, et al. Nonvolatile electrical bistability of organic metal-nanocluster organic system. Appl Phys Lett, 2003,82:1419
- [5] Mukherjee B, Pal A J. On the origin of multilevel conductance and memory in ultrathin organic films. Synth Met. 2005, 155:336
- [6] Xu W, Guo P, Lu Y X, et al. A writable, erasable and readable molecular-based electrical bistable device. Vacuum Science and Technology, 2004, 24:401(in Chinese) [徐伟,郭鹏, 吕银祥,等. — 种可擦写可读出的分子基电双稳器件. 真空科学与技术, 2004, 24: 401]
- [7] Tu C H, Lai Y S, Kwong D L. Memory effect in the current-voltage characteristic of 8-hydroquinoline aluminum salt films. IEEE Electron Device Lett, 2006, 27, 354
- [8] Tondelier D, Lmimouni K, Vuillaume D, et al. Metal-organic-metal bistable memory devices. Appl Phys Lett, 2004, 85, 5763
- [9] Chen J S.Ma D G. Performance improvement by charge trapping of doping fluorescent dyes in organic memory devices. J Appl Phy,2006,100:034512
- [10] Chu C W, Ouyang J Y, Tseng J H, et al. Organic donor-acceptor system for use in memory devices. Adv Mater, 2005, 17:1440
- [11] Pacsial E J, Alexander D, Alvarado R J, et al. Donor-acceptor interactions in self-assembled monolayers and their consequences on interfacial electron transfer. Phys Chem B,2004,108:19307
- [12] Li J C,Blackstock S C,Szulczewski G J. Interfaces between metal and arylamine molecular films as probed with the anode interfacial engineering approach in single-layer organic diodes. J Phys Chem B,2006,110:17493
- [13] Lu Y X, Zhou H, Guo P, et al. Structure of 2-(1-phenylimidiazolidin-2-ylidene)-malononitrile and 2-(hexahydropyrimidinyl-2-ylidene)-malononitrile. J Chem Cryst, 2006, 36:691
- [14] Guo P, Dong Y W, Huo Z Q, et al. A reversible organic electrical bistable device for nonvolatile memory applications. Vacuum Science and Technology, 2007, 27:89(in Chinese)[郭鹏,董元伟,霍 钟祺,等.具有非易失存储功能的可逆有机电双稳器件.真空科学 与技术, 2007, 27:89]

## Fabrication and Memory Characteristics of a New Organic Thin Film Device\*

Guo Peng, Ji Xin, Dong Yuanwei, Lü Yinxiang, and Xu Wei<sup>†</sup>

(Department of Materials Science, Fudan University, Shanghai 200433, China)

**Abstract:** The reversible electrical bistability of a new organic thin film device with a metal/organic/metal sandwich structure is investigated. The anode and cathode metals of the device are Ag and Al, respectively, and were fabricated by vacuum evaporation. The middle medium is 2-(hexahydropyrimidin-2-ylidene)-malononitrile (HPYM). The device, which has polar memory characteristics, can be written from a low-conductance state to a high-conductance state by a voltage pulse and can be erased by a reverse voltage. The device with a thin Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> layer between base metal Al and HPYM can produce different high-conductance states through the application of different positive voltages, resulting in multilevel memory capability. The effect of different electrode combinations on conductance switching devices is studied and UV-Vis absorption spectra and Raman spectra are used to obtain information on the interfaces of the devices.

Key words: organic film device; memory device; electrical bistability; multilevel conductance EEACC: 2520M Article ID: 0253-4177(2008)01-0140-04

<sup>\*</sup> Project supported by the Trans-Century Training Program Foundation for the Talents by the Ministry of Education of China, the National Natural Science Foundation of China (No. 60171008), and the Specialized Foundation for Nano-Technology of Shanghai Science and Technology Committee (Nos. 0214nm005, 0452nm087)

<sup>†</sup> Corresponding author. Email: wexu@fudan.edu. cn

Received 5 July 2007, revised manuscript received 3 August 2007